

DIN EN ISO 12179:2023-04 (D)

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Oberflächenbeschaffenheit:
Tastschnittverfahren - Kalibrierung von Tastschnittgeräten (ISO 12179:2021);
Deutsche Fassung EN ISO 12179:2022

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	4
Vorwort.....	5
Einleitung.....	6
1 Anwendungsbereich.....	7
2 Normative Verweisungen.....	7
3 Begriffe.....	7
4 Anwendungsbedingungen.....	9
4.1 Bestandteile und Konfigurationen von Tastschnittgeräten.....	9
4.2 Kalibrierung einer Konfiguration.....	9
4.3 Ort der Kalibrierung.....	9
4.4 Fehler.....	9
5 Normale.....	9
6 Messtechnische Merkmale von Tastschnittgeräten.....	12
6.1 Allgemeines.....	12
6.2 Kalibrierung des Restprofils.....	12
6.3 Kalibrierung der vertikalen Profilkomponente.....	13
6.4 Kalibrierung der horizontalen Profilkomponente.....	13
6.5 Kalibrierung des Profilkoordinatensystems.....	13
6.6 Kalibrierung des gesamten Tastschnittgerätes.....	13
7 Kalibrierung.....	13
7.1 Vorbereitung zur Kalibrierung.....	13
7.2 Auswertung des Restprofils.....	14
7.3 Kalibrierung der vertikalen Profilkomponente.....	14
7.3.1 Allgemeines.....	14
7.3.2 Verfahren.....	14
7.4 Kalibrierung der horizontalen Profilkomponente.....	14
7.4.1 Allgemeines.....	14
7.4.2 Verfahren.....	15
7.5 Kalibrierung des Profilkoordinatensystems.....	15
7.5.1 Allgemeines.....	15
7.5.2 Verfahren.....	15
7.6 Kalibrierung des gesamten Tastschnittgerätes.....	15
7.6.1 Allgemeines.....	15
7.6.2 Verfahren.....	15
7.7 Andere Kalibrierungen.....	15
8 Messunsicherheit.....	16
8.1 Informationen aus dem Kalibrierschein eines Normals.....	16
8.2 Messunsicherheit der Werte, die während der Kalibrierung eines Messgerätes mittels eines Normals gemessen wurden.....	16
9 Kalibrierschein für Tastschnittgeräte.....	17

10	Allgemeine Angaben.....	17
	Anhang A (normativ) Kalibrierung der Messgeräte zur Messung von Kenngrößen der Motif-Methode.....	18
A.1	Allgemeines.....	18
A.2	Normale.....	18
A.2.1	Allgemeines.....	18
A.2.2	Oberflächenkenngrößen.....	18
A.3	Kalibrierung.....	18
	Anhang B (normativ) Kalibrierung von Sekundärmessgeräten für die Messung der Oberflächenbeschaffenheit.....	20
	Anhang C (informativ) Beispiel: Kenngröße R_a für ein Raunormal.....	21
	Anhang D (informativ) Konzeptdiagramm.....	24
	Anhang E (informativ) Überblick über Normen zu profilhaften und flächenhaften Oberflächenbeschaffenheiten im ISO GPS-Matrix-Modell.....	25
	Anhang F (informativ) Beziehung zum ISO GPS-Matrixmodell.....	26
F.1	Allgemeines.....	26
F.2	Information zu diesem Dokument und zu seiner Anwendung.....	26
F.3	Lage im ISO GPS-Matrix-Modell.....	26
F.4	Zusammenhang mit Internationalen Normen.....	26
	Literaturhinweise.....	27